

2.0基站产品化测试 - 错误 #2174

15P_Pre1T4版本，5.8G稳定性长跑测试基站挂死，DU打印mac demux error

2024-09-23 12:06 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述
问题：5.8G稳定性长跑测试，运行了38小时，DU挂死。 phy打印错误:[09-22 07:53:02.618][ERROR]DU2PHY_api_error_check_use_empty_channels: phyInstance ⁰ incrementSfn ¹ at Tx[764 8] du打印错误：[09-22 07:53:02.257][ERR_07]rgDUXDemuxData: mac demux error!!! From phy.lclId=1,subPduLen=17,pduActLen=61 pduCnt=1 版本：15P_Pre1T4，du替换2024-09-20-11-38-00包，phy替换2.2.36包，cu替换2159问题包。 参数：大上行上行单天线，中心频率 5879.46，txpower -30，p0 -70，无打桩，3台RU合并MRU起站。 测试终端：5.8G转频终端8台，5中3差。

历史记录

#1 - 2024-09-27 09:21 - 匿名用户
查看DU日志时发现是DU的WLS内存中的heap内存耗尽，分配内存失败导致DU挂死； 打开heap内存部分日志后验证反复接入的场景打印后发现在释放UE的时候heap内存存在内存泄漏(du_ue_cell_mgr的mod_cell_req_list和remove_cell_req_list只做了clear的操作，未释放heap内存)的问题，修改后通过日志验证发现释放UE的时候该部分内存已释放。
#2 - 2024-10-12 11:59 - 匿名用户
- 状态从新建变更为进行中
#3 - 2024-10-15 11:02 - 匿名用户
- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从匿名用户变更为黄毅
#4 - 2024-12-04 15:49 - 黄毅
- 状态从转测试变更为已解决

文件

yzrt_du_20240922075252_1726962782.log.zip	19.8 MB	2024-09-23	黄毅
yzrt_l1_20240922075151_1726962782.log.zip	43.9 MB	2024-09-23	黄毅